

# 第16回XAFS討論会

開催  
日程

2013年 9月5日(木)・6日(金)・7日(土)

場所

東京大学理学部化学本館 講堂 (113-0033 東京都文京区本郷7-3-1)

HP

第16回XAFS討論会

検索

## 討論内容

X線吸収微細構造(XAFS)及び関連現象に関する理論、解析方法、実験技術、基礎及び応用研究



## 招待講演

- ▶ 竹田美和(あいちシンクロトロン) 「あいちシンクロトロン光施設とその利用事例」
- ▶ 宍戸哲也(首都大) 「触媒調製時ならびに反応中における活性種の挙動の解明を目指したXAFS測定」
- ▶ 増野敦信(東大生研) 「XAFSによる非晶質相と準安定結晶相の局所構造解析」
- ▶ 木村正雄(新日鐵住金) 「実材料/実プロセスにおけるXAFS研究のインパクト ~ 触媒(nm-scale)から製鉄(m-scale)まで ~」

## 参加費

日本XAFS研究会会員: 3,000円  
(年会費2,000円を含む)

日本化学会会員: 3,000円

非会員: 3,000円

学生: 1,000円

賛助会員: 無料

## 主催

日本XAFS研究会

## 協賛

日本物理学会、応用物理学会、日本放射光学会、表面科学会、日本結晶学会、日本分光学会、触媒学会、日本分析化学会、日本化学会、日本セラミックス協会、日本金属学会、日本顕微鏡学会

## 後援

ツジ電子、クリアパルス、神津精機、キャンベラジャパン、仁木工芸、アールデック、リガク、真空光学、VGシエンタ

## 連絡先・予稿提出先

第16回XAFS討論会事務局  
xafs16@chem.s.u-tokyo.ac.jp  
実行委員長 宇尾基弘(東京医科歯科大)

発表申し込み締め切り

2013年7月15日

事前参加申し込み締め切り

2013年8月23日